

1. Record Nr.	UNINA9910145625903321
Titolo	2006 IEEE International Conference on Microelectronic Test Structures
Pubbl/distr/stampa	[Place of publication not identified], : I E E E, 2006
ISBN	1-5090-9294-3
Descrizione fisica	1 online resource (xiii, 229 pages) : illustrations
Disciplina	621.3810287
Soggetti	Electronic apparatus and appliances - Testing Semiconductors - Testing
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph